

第三者評価における大略テスト設計書を用いたテストの俯瞰及びテスト設計までのフレームワークの検討

日本電気株式会社

伊藤拓也

t-itou@ey.jp.nec.com

テストにおける問題点

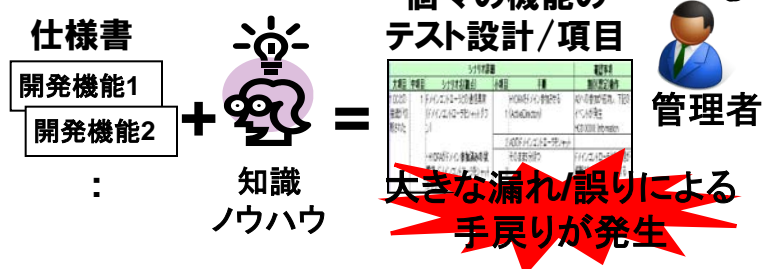
- 様々な改善によりテストの質は向上したが...
- テスト全体の把握が困難
テスト観点が増えたことにより、何をどこまで押さえているのか判断が困難
 - テスト設計漏れ／誤り
テストの質が上がるとともに難易度も上がり、漏れや誤りが増加し、手戻りが発生

テスト設計フレームワークによる解決

- テスト全体像の把握
開発機能毎のテスト設計を行う前に、大略テスト設計(主に俯瞰表(拡張したDSM))を作成
- テスト設計漏れ／誤りの防止
大略テスト設計書自体を開発機能毎のテストを設計での直接的なインプットとすることで観点漏れを防止

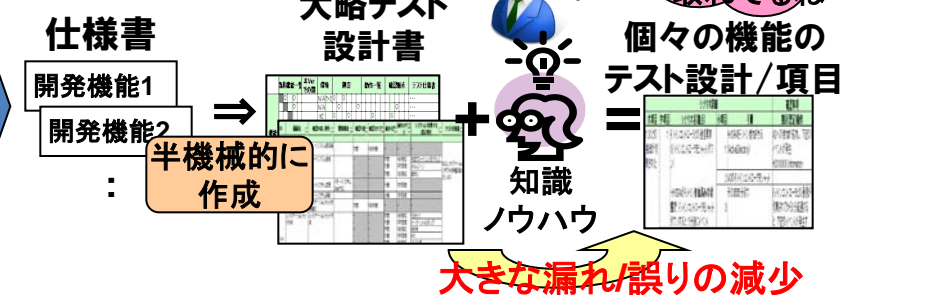
従来のプロセス

各開発機能のテスト設計時に評価担当者は既存の機能の知識、ノウハウを元に設計を行う。

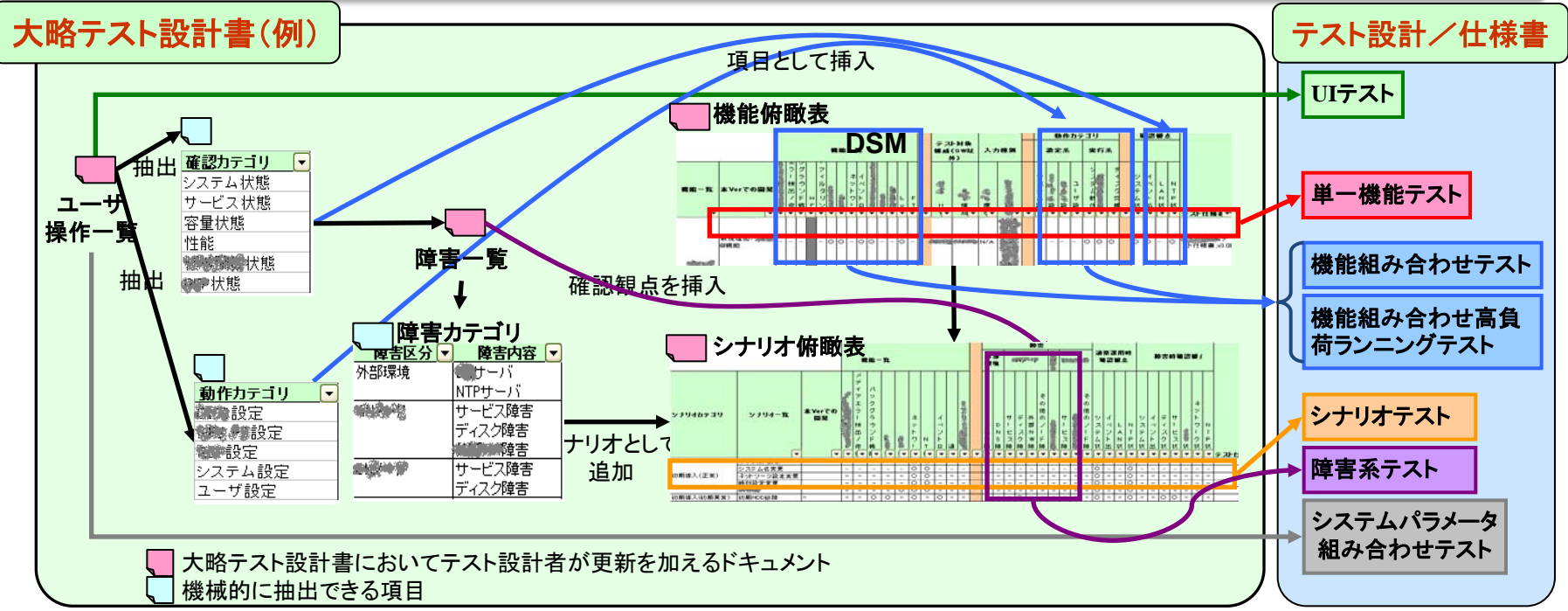


改善後のプロセス

大略設計書を用いてテストの全体像を把握し、それに基づいて各開発機能のテスト設計を行う。



大略テスト設計書を用いたフレームワーク



評価

- 実際に1機能に関して機能俯瞰表(少し荒いレベルのもの)を試行。通常3~4回行うレビューが2回となり、定性的にも効果があると判断。

今後の課題

- 新しいテスト観点の追加の方法の検討
- スキル依存性が高い「確認観点のカテゴリの洗い出し方」と「障害一覧の確認観点のチェック」の更なる標準化
- 本手法が有効に使える製品種別の明確化